CURSOS DEL CITIUS

EL SECRETARIADO DE CENTROS, INSTITUTOS, SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN (SCISI) Y DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA (CITIUS)
EN COLABORACIÓN CON EL CENTRO DE FORMACIÓN PERMANENTE (CFP)

COMUNICA

Que se va a impartir el curso que se relaciona a continuación:

2011-06-07_MIC-NANO:
"TÉCNICAS DE CARACTERIZACIÓN SUPERFICIAL NANOMÉTRICAS AFM, STM Y FESEM".

Contenidos:

1. Normas y riesgos asociados al uso del microscopio electrónico de barrido y microscopios de barrido por sonda.
2. Fundamentos de la microscopía AFM-STM.
3. Fundamentos de la microscopía electrónica de barrido: interacción electrón-materia, resolución.
4. Modos de operación con Microscopio AFM-STM Pico Scan 2500:
    a. AFM Contacto.
    b. AFM Contacto intermitente.
    c. STM Corriente constante.
5. Medidas de dominios magnéticos: Magnetic Force Microscopy (MFM).
6. Operación con el FESEM Hitachi S5200.
7. Captura de imagen en el FESEM Hitachi S2500.
8. Técnicas para la observación de muestras según su naturaleza y conductividad.
9. Técnicas de preparación de muestras.

Destinatarios: Cualquier persona cuya actividad o investigación esté o vaya a estar relacionada con la microscopía electrónica de barrido y la microscopía de barrido por sonda.
Duración, fechas y horario: 30 horas (6 teóricas y 24 prácticas); del 7 al 30 de junio de 2011; de lunes a viernes en horario de 8.00 a 15.00 horas.
Más información y plazos de preinscripción y matrícula: Consultar página web del CFP.
http://www.cfp.us.es/web/ficha_avanzada.asp?id_titulo=1001&tipo=FC&basica=1
Coste de matrícula: 195.00 € (tasas incluidas).